

Breve reseña de algunos de nuestros productos más importantes

Hitos de nuestros productos industriales

Olympus inició la producción de microscopios dedicados a las ciencias de la vida en 1919. Diez años más tarde, la tecnología de nuestros microscopios sería utilizada en aplicaciones industriales. ¡El resto pertenece a la historia!



1929

Primera incursión de Olympus en el ámbito de la inspección industrial dada por el microscopio metalográfico (o metalúrgico) MC.

1955

Inicios de nuestro primer microscopio metrológico: el microinterferómetro MI.

1968

Lanzamiento de las series IFS: nuestros primeros productos RVI como parte del desarrollo tecnológico de nuestra división médica que fue sabiamente aprovechado.

1973

Lanzamiento del MODEL 5221: el primer medidor de espesores por ultrasonido comercial del mundo con medición multimodo y calibración de la velocidad acústica.

1984

Inicios del EPOCH® 2002: el primer detector de defectos digital portátil para inspecciones en campo del mundo.

1988

Lanzamiento del primer medidor de espesores del mundo con registrador de datos integrado: MODEL 22DL.

1994

Capacidades integradas de registro de datos y administración de archivos en los dispositivos portátiles por ultrasonido convencional, presentadas a través del detector de defectos EPOCH III.



Lanzamiento de nuestro primer microscopio láser: el OLS1000.

2001

Lanzamiento de nuestro primer analizador portátil XRF: el XT.



Inicios de la reconocida serie de videoscopios IPLEX™.

2003

Portabilidad de la tecnología de ultrasonido multielemento inaugurada con el lanzamiento del detector de defectos OmniScan®.

2008

Con el lanzamiento de los analizadores BTX® y TERRA® se proporcionó al fin analizadores XRD de estructura lo suficientemente pequeña para caber en una mesa o ser transportados a campo.

2010

Inicios del detector de defectos EPOCH 600: un equipo portátil funcional y resistente.

2011

Lanzamiento del dispositivo portátil por ultrasonido multielemento (*Phased Array*) mejor vendido: el OmniScan MX2.

2012

Digitalización de nuestros microscopios inaugurada con el lanzamiento de la serie DSX.

2014

Inicios del detector de defectos por corrientes de Foucault multielementos: NORTEC® 600

2016

Lanzamiento del primer analizador portátil XRF diseñado para cumplir con la normativa IP64/65: el analizador Vanta™.



El videoscopio IPLEX NX ilustra la llegada de la tecnología de alta definición para las inspecciones visuales remotas (RVI™).

2017

Inicios de nuestro detector de defectos por ultrasonido más portátil: EPOCH 6LT.



Una nueva era en el marco de la conexión digital laboral con el lanzamiento de la Olympus Scientific Cloud™.

